

サンビーム 発表内容

ポスター発表 9月9日(金)			
S-01	河瀬和雅	三菱電機(株)	X線反射率測定によるOラジカル改質されたCVD-SiO <sub>2</sub> 膜の評価
S-02	淡路直樹	(株)富士通研究所	フーリエ変換ホログラフィー法によるin-situ ナノ・イメージング
S-03	野村健二	(株)富士通研究所	新規光触媒Tiアパタイトの特徴と構造評価
S-04	山崎孝則	日立電線(株)	放射線・熱劣化を受けたポリマ中の酸化防止剤の挙動解析
S-05	米山明男	(株)日立製作所	マイクロビーム走査型高速蛍光X線顕微鏡の開発
S-06	神前 隆	パナソニック(株)	リチウムイオン電池用LiNiO <sub>2</sub> 系正極材料のXAFS測定
S-07	浅田 敏広	日産自動車(株)	リチウムイオン電池用材料のマイクロXAFS測定
S-08	吉田泰弘	日亜化学工業(株)	XAFSによるLiイオン二次電池正極材料の局所構造解析
S-09	高橋直子	(株)豊田中央研究所	重水素透過後におけるPd基板のXRF分析
S-10	沖 充浩	(株)東芝	XAFSを用いた工業材料中に含まれる環境規制物質の価数評価
S-11	高石 理一郎	(株)東芝	半導体デバイスのCTR分析
S-12	栃原義久	(財)電力中央研究所	XAFSによる排ガス浄化技術の評価
S-13	渡邊恒典	関西電力(株)	還元ガス処理を行ったガリウム-アルミニウム複合酸化物触媒における活性点のXAFS解析
S-14	越谷 直樹	ソニー(株)	ペンタセン結晶薄膜のX線回折法による構造評価
S-15	飯原順次	住友電気工業(株)	環境製品、リサイクル技術開発のための放射光利用
S-16	北原 周	(株)神戸製鋼所	In-situ XRDによる鋼板の高温酸化挙動の観察
S-17	清瀧 元	川崎重工業(株)	貴金属担持各種酸化物排ガス浄化触媒の劣化機構に関する検討
S-18	井頭 賢一郎	川崎重工業(株)	炭素繊維の回折光を利用したFRPの応力評価
S-19	尾崎 伸司	パナソニック(株)	サンビーム蛍光X線装置の現状
S-20	榊 篤史	日亜化学工業(株)	サンビームのマイクロビーム装置